

FIG. 1
09405716-002499

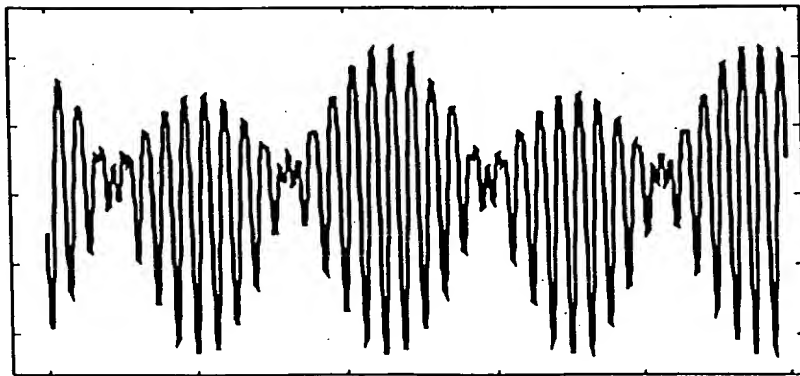
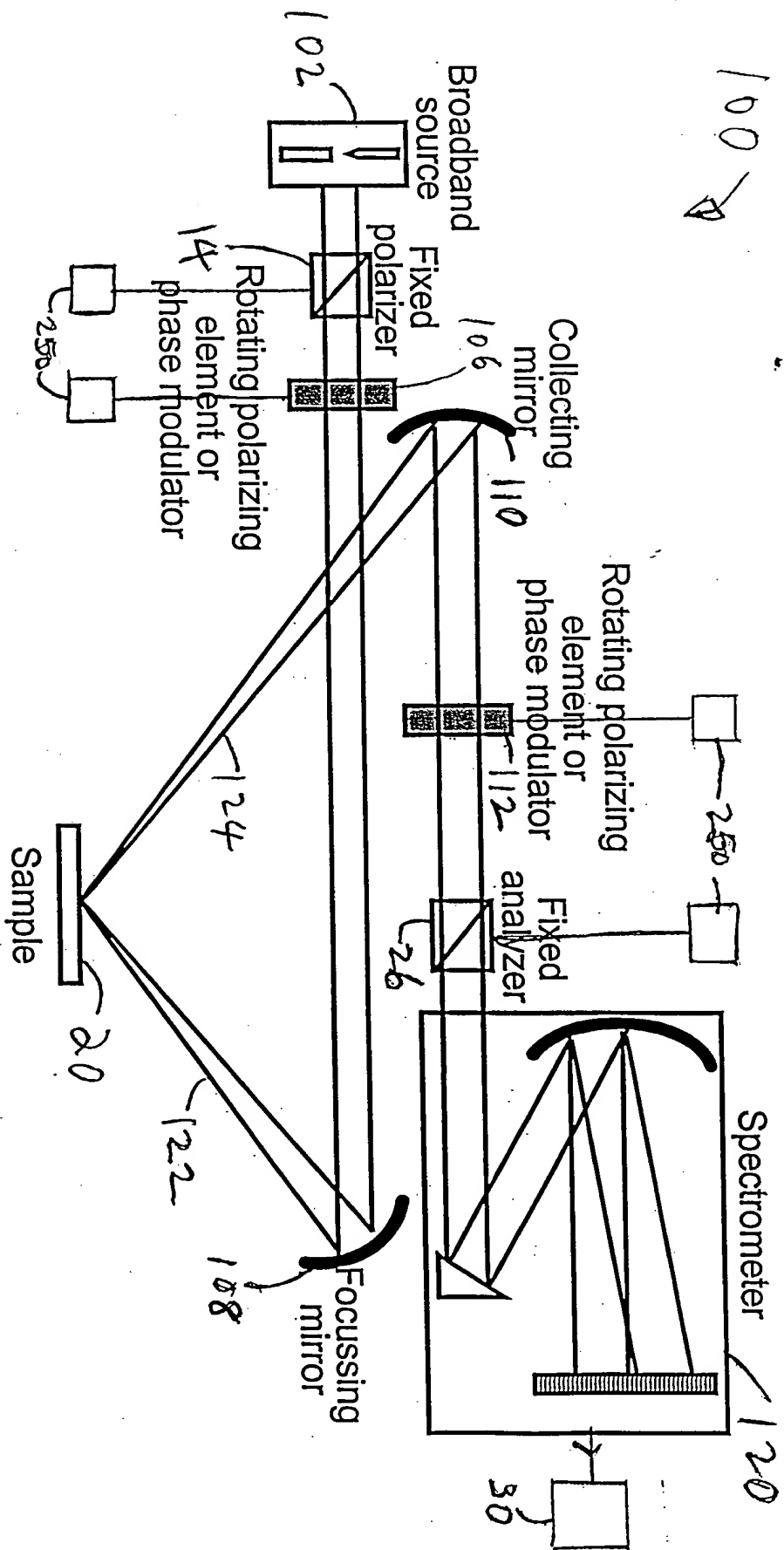
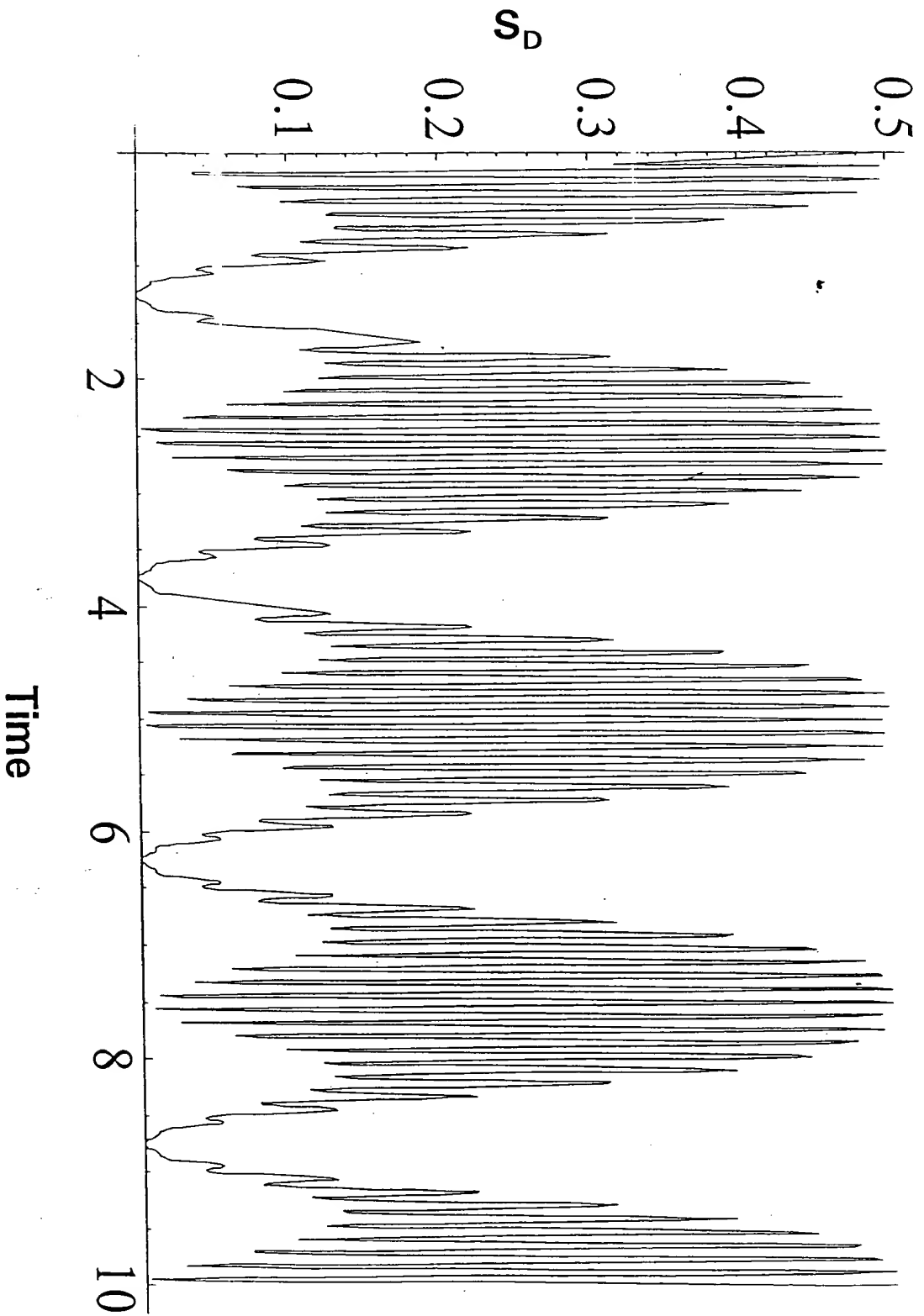


Figure 2 An example of detector signal as a function of time.

004020-0750460

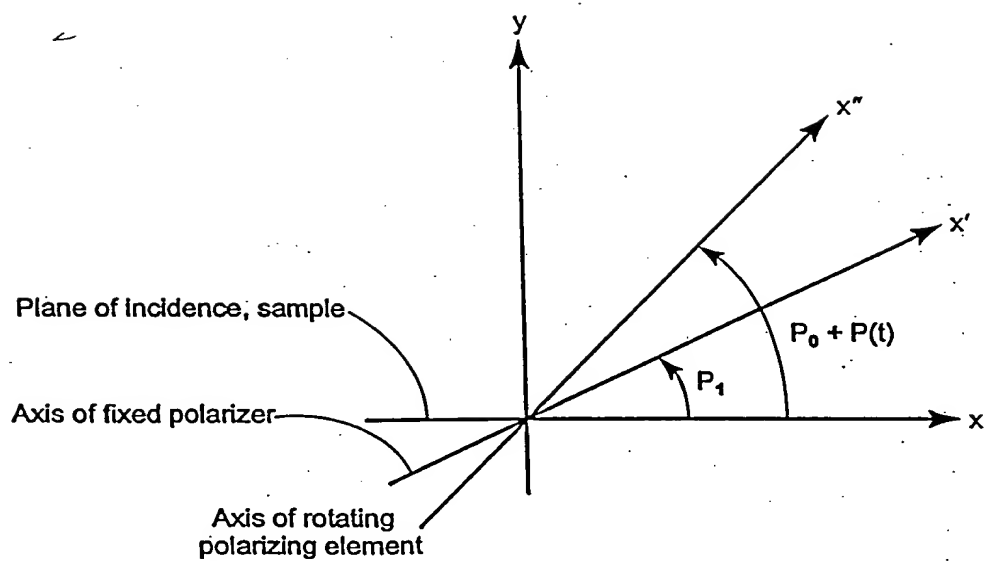


04/04/2023 09:09:09



F14.4
00405715-000000

000000-00000000



5
Figure 1 Angle definitions in polarization generation side.

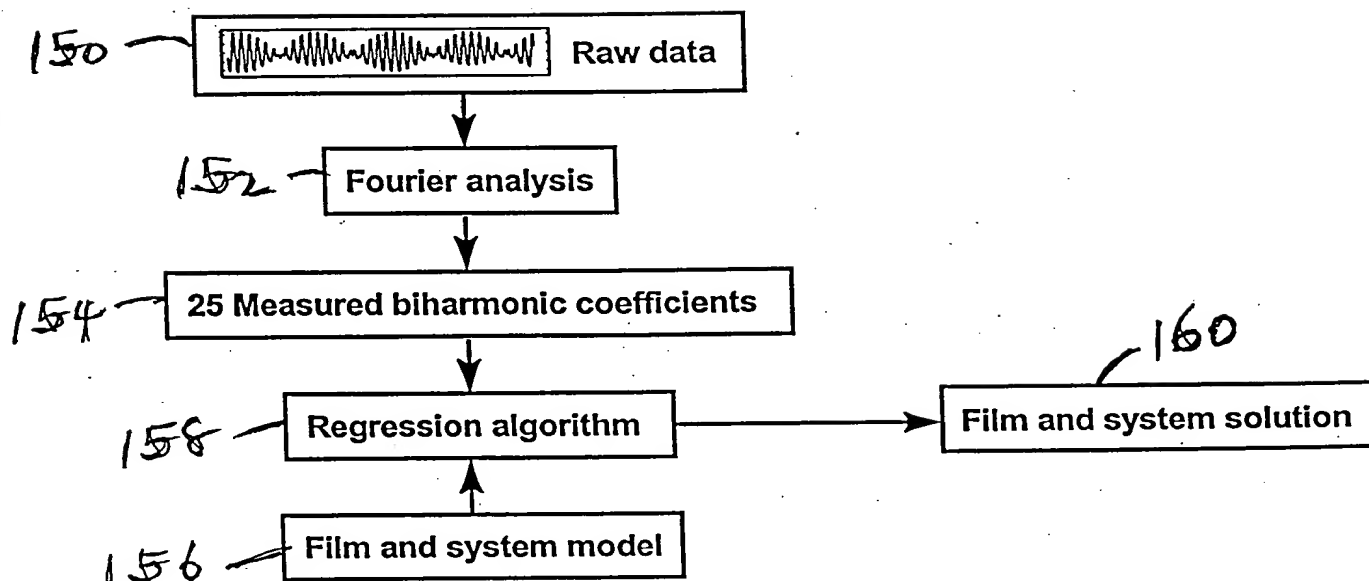
[illegible]

Figure 8 Flow chart of the regression algorithm.

FIG. 7A
Rotating-polarizer

FIG. 7B

Rotating-analyzer

FIG. 7C

Rotating-both

FIG. 7D

Rotating-polarizer

FIG. 7E

Rotating-analyzer

FIG. 7F

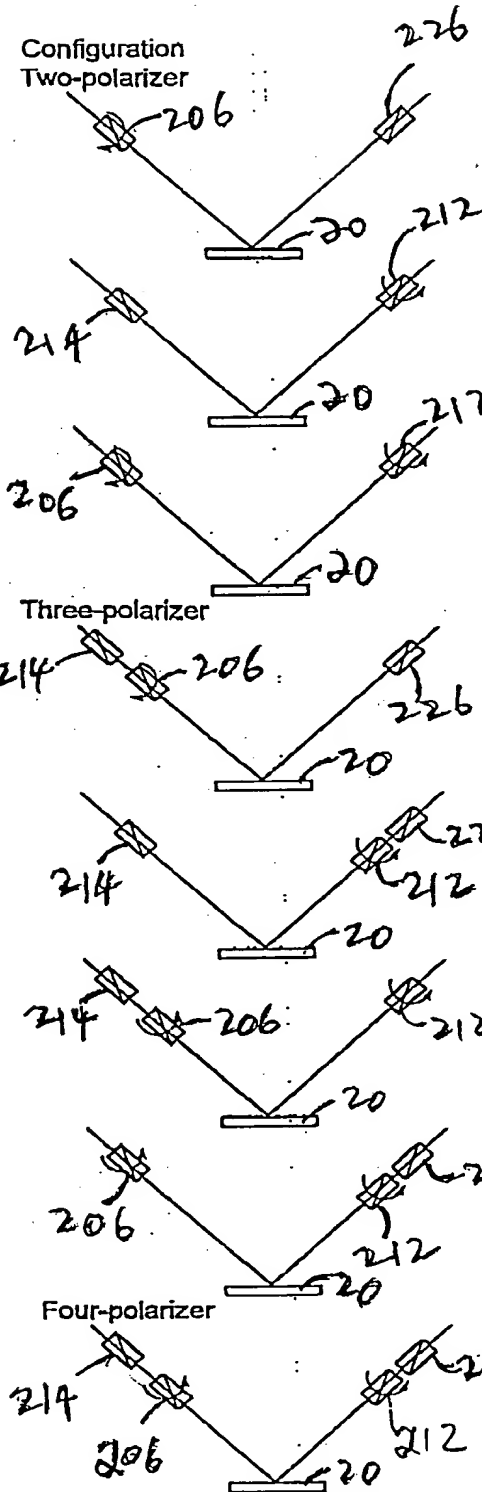
Rotating-both, pre-polarizer

FIG. 7G

Rotating-both, post-analyzer

FIG. 7H

Rotating-both



Harmonics & system parameters

3 harmonics.
AOI, P_1 , A_0 ,
 P_P , q_P , P_{A0} , q_{A0} ,
 $S_i(\lambda)$.

3 harmonics.
AOI, P_0 , A_1 ,
 P_{P0} , q_{P0} , P_A , q_A ,
 $S_i(\lambda)$.

5 harmonics, 3 independent
AOI, P_1 , A_1 ,
 P_P , q_P , P_A , q_A ,
 $S_i(\lambda)$.

5 harmonics.
AOI, P_0 , P_1 , A_0 ,
 P_{P0} , q_{P0} , (P_P , q_P), P_A , q_A ,
 $S_i(\lambda)$.

5 harmonics.
AOI, P_0 , A_1 , A_0 ,
 P_{P0} , q_{P0} , P_A , q_A , (P_{A0} , q_{A0}),
 $S_i(\lambda)$.

15 harmonics, 8 independent.
AOI, P_0 , P_1 , A_1 ,
 P_{P0} , q_{P0} , (P_P , q_P), P_A , q_A ,
 $S_i(\lambda)$.

15 harmonics, 8 independent.
AOI, P_1 , A_1 , A_0 ,
 P_P , q_P , P_A , q_A , (P_{A0} , q_{A0}),
 $S_i(\lambda)$.

25 harmonics.
AOI, P_0 , P_1 , A_1 , A_0 ,
 P_{P0} , q_{P0} , (P_G , q_G), P_A , q_A , (P_{A0} , q_{A0}),
 $S_i(\lambda)$.

- P_0 , A_0 – Angles of fixed polarizer and analyzer
- P_1 , A_1 – Initial angles of rotating polarizer and analyzer corresponding to encoder zero
- p , q – Unpolarized and elliptically polarized factors in polarizer and analyzer Mueller matrix

FIG. 8A

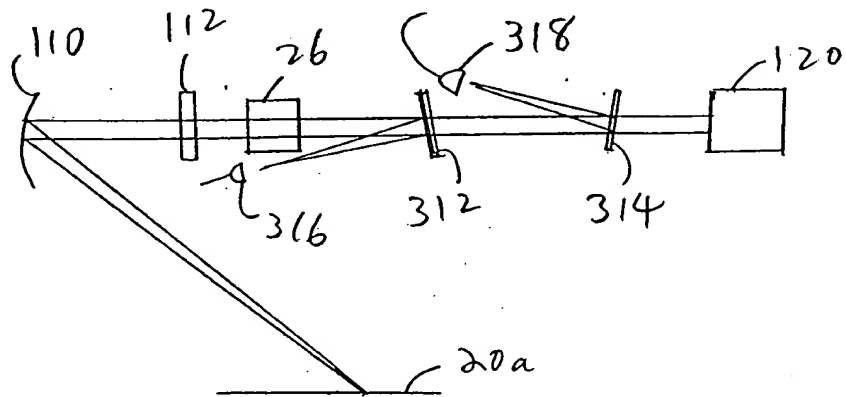
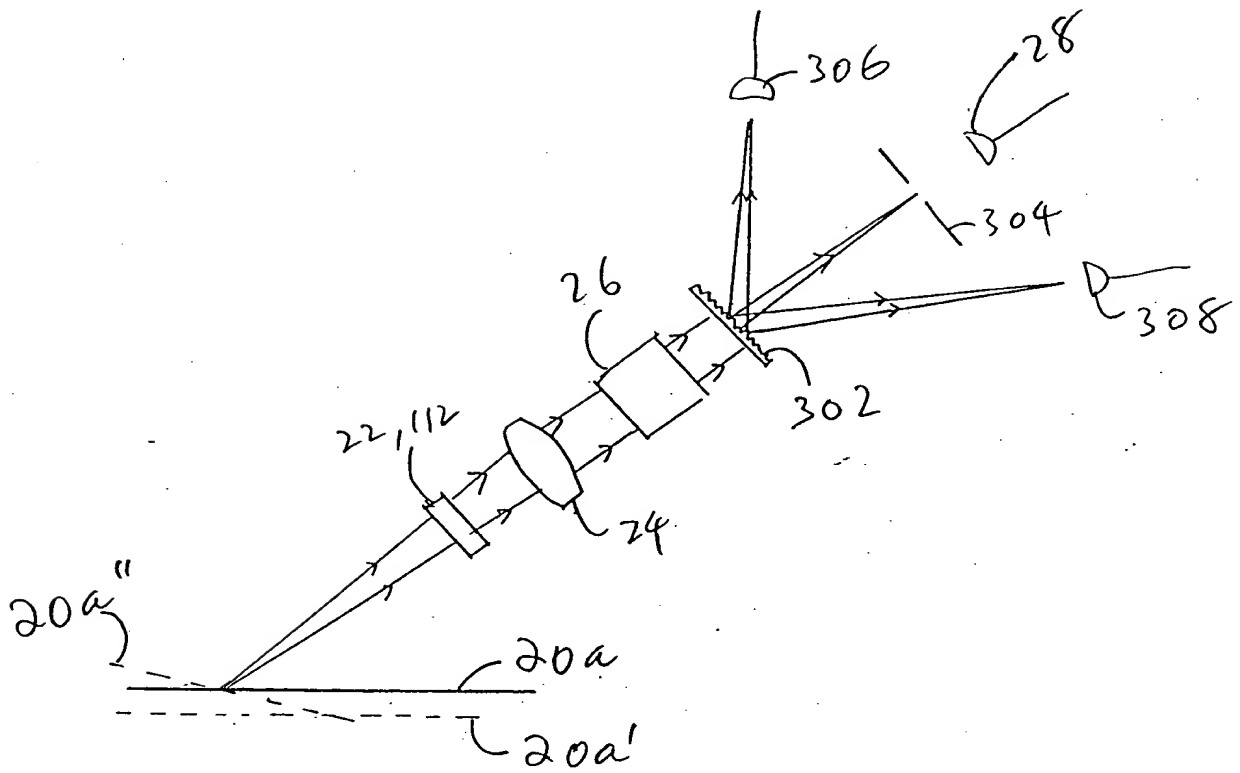
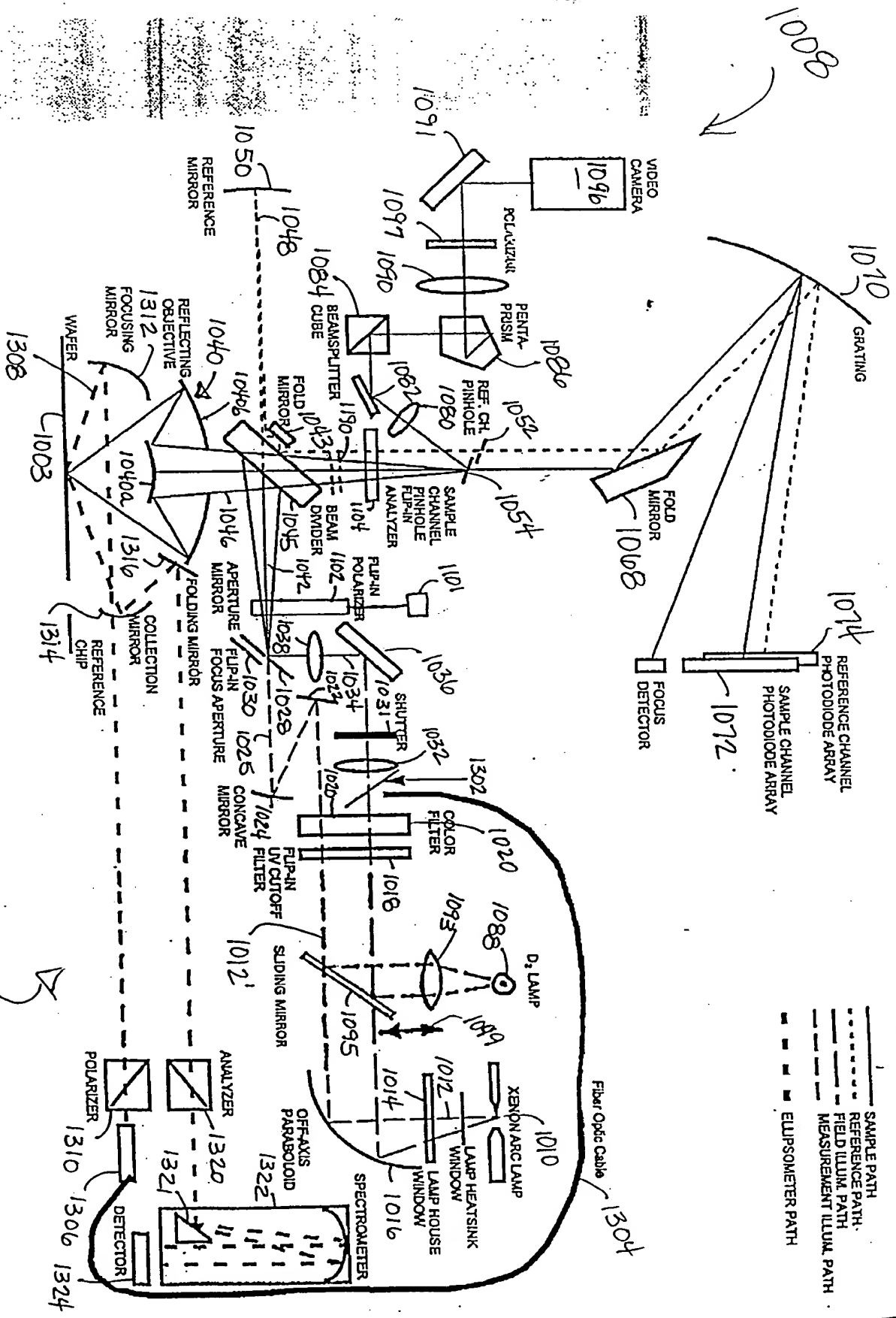


FIG. 8B

SM4.12/17/83

- SAMPLE PATH
- REFERENCE PATH
- FIELD ILLUM. PATH
- MEASUREMENT ILLUM. PATH
- ELLIPSOMETER PATH



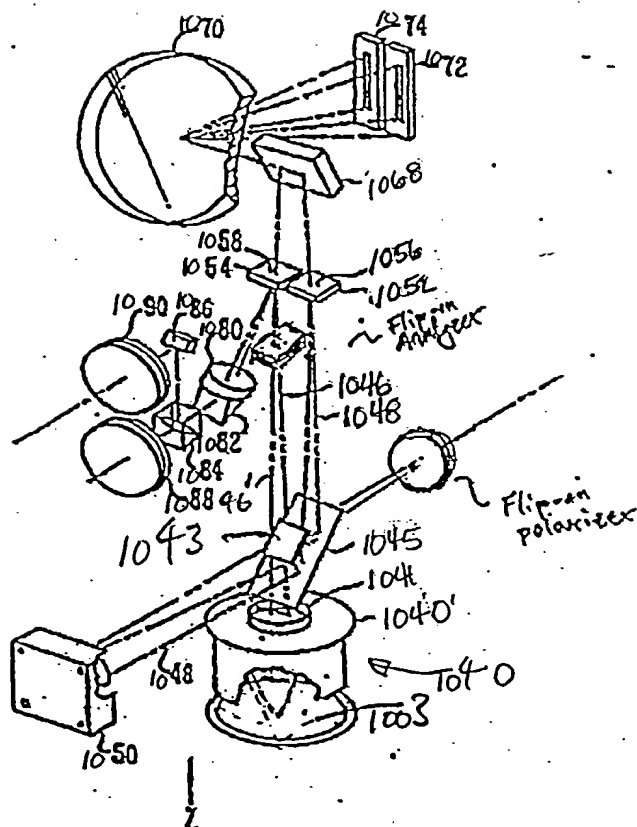


FIG. 10

FIG. 11A Descriptions of PDBS system

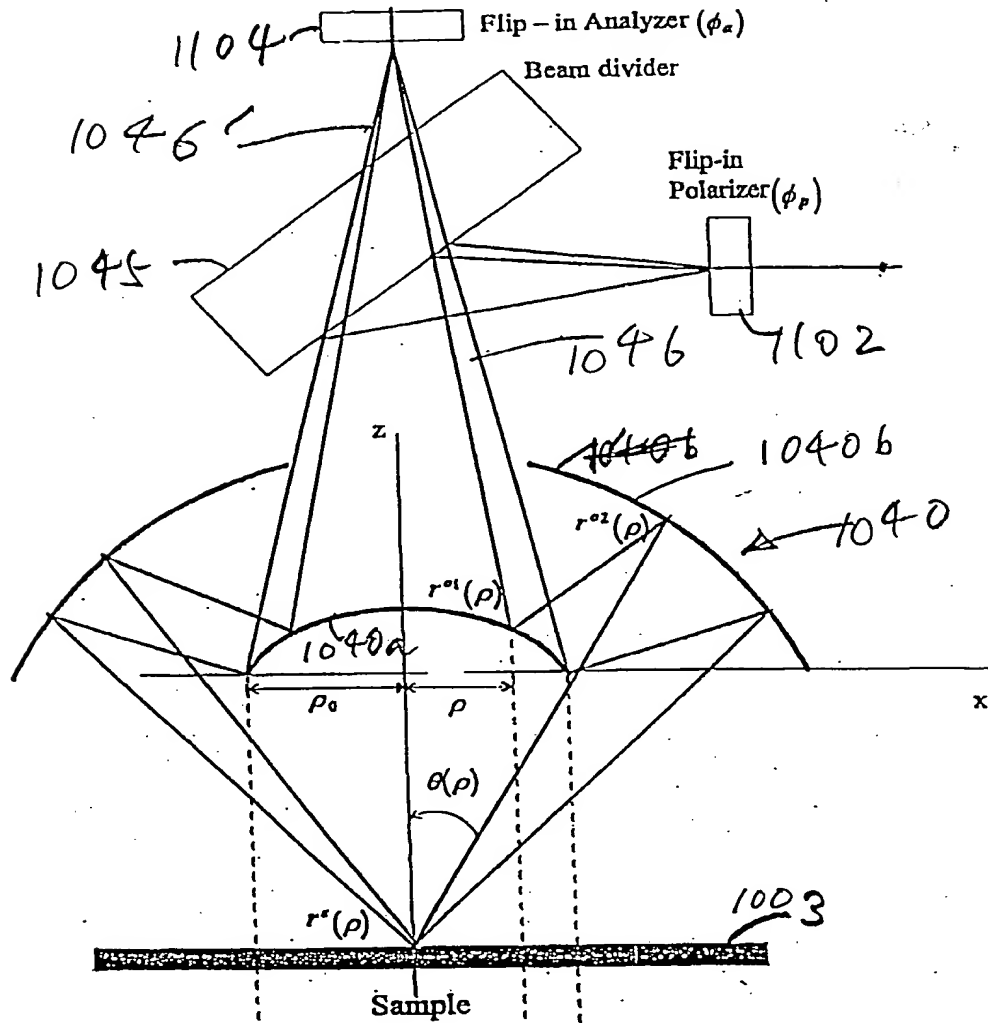


FIG. 11B

Descriptions of PDBS system

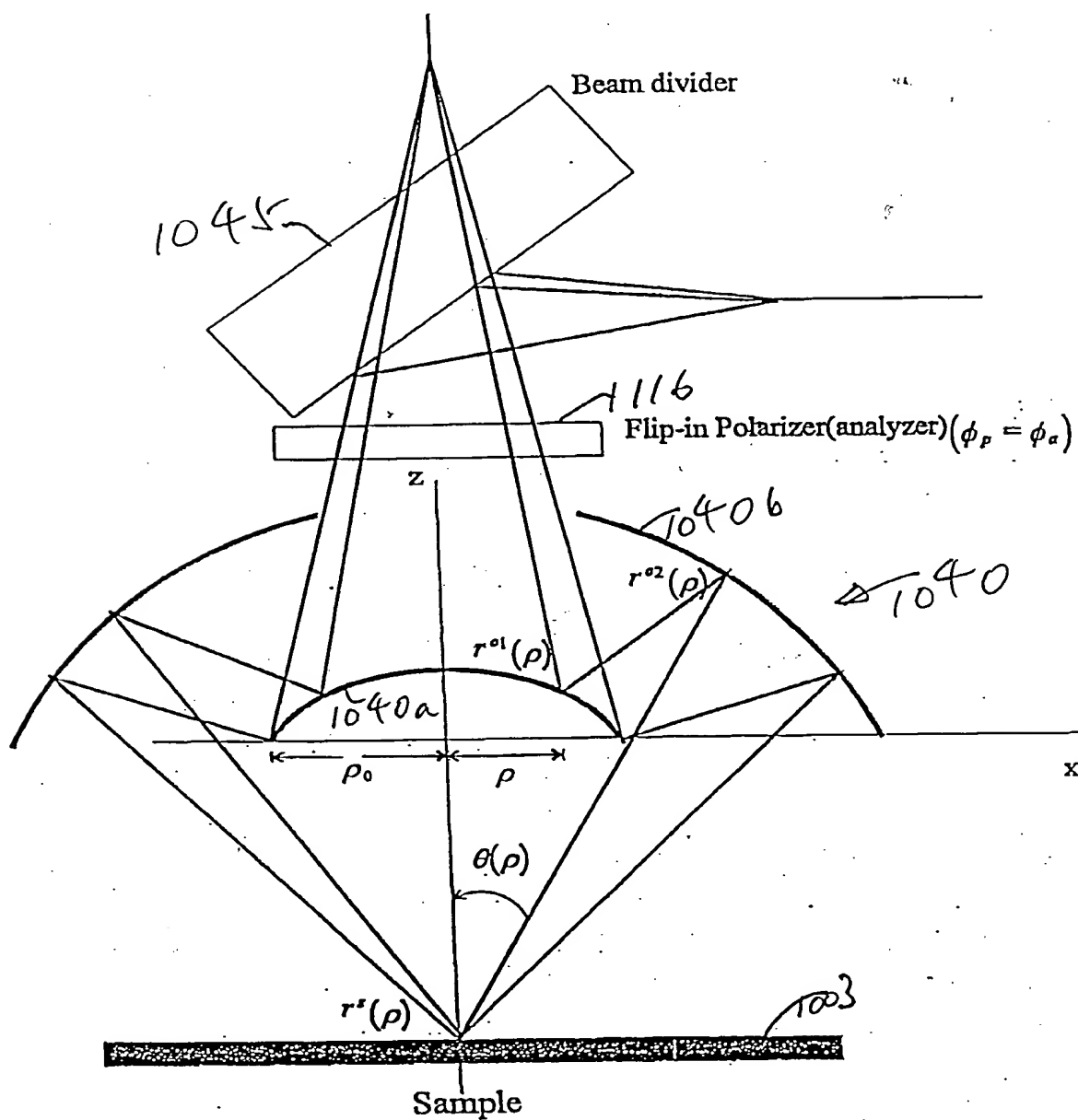


Fig. 12

時間	場所	内容	備考
10:00	本校	本校の歴史と現状について説明する。	
10:30	本校	本校の教育方針と特色について説明する。	
11:00	本校	本校の施設と設備について説明する。	
11:30	本校	本校の教職員について説明する。	
12:00	本校	本校の卒業生について説明する。	
12:30	本校	本校の将来について説明する。	
13:00	本校	本校の問い合わせ先について説明する。	
13:30	本校	本校の募集要項について説明する。	
14:00	本校	本校の入試について説明する。	
14:30	本校	本校の奨学金について説明する。	
15:00	本校	本校のキャリア支援について説明する。	
15:30	本校	本校の国際交流について説明する。	
16:00	本校	本校のスポーツについて説明する。	
16:30	本校	本校の文化活動について説明する。	
17:00	本校	本校の閉校式を終了する。	

The diagram illustrates a beam splitter and a sample. The beam splitter is labeled 1040 and is shown as a rectangular block. A beam of light is incident on the beam splitter and is split into two paths. One path is labeled 1040a and the other is labeled 1040b. The beam splitter is positioned above a sample, which is labeled 1003. The sample is a circular disk with a central hole. The disk is divided into four quadrants, labeled 1106a, 1106b, 1106c, and 1106d. The central hole is labeled 1106e. The disk is shown in a perspective view, with the top surface labeled 1106f and the bottom surface labeled 1106g. The disk is surrounded by a circular region labeled 1106h. The disk is shown in a perspective view, with the top surface labeled 1106f and the bottom surface labeled 1106g. The disk is surrounded by a circular region labeled 1106h.

Fig. 13B